



Liste des équipements de caractérisation et de métrologie optiques

DESCRIPTION	FABRICANT	# MODÈLE	TYPES DE MESURES
Interféromètre laser, faisceau de 6 po de diamètre (633 nm)	Zygo	DynaFiz	
Machine à centrer les lentilles	TriOptics	OptiSpheric AF	
Mesure de la position des surfaces optiques	Fogale	Lenscan LS600-1CH	Inspection des composants optiques, précision de la surface optique, etc.
Analyseur d'image pour évaluer la FTM d'un objectif (fonction de transfert de modulation)	Optikos	VideoMTF System	
Capteur de front d'onde haute résolution, VIS-NIR (400-1100 nm)	Phasics	SID4 HR GE	Performance des assemblages optiques, centrage de lentilles, résolution d'image, erreur de front d'onde, etc.
Capteur de front d'onde à double bande, MWIR et LWIR (3 à 5 µm et 8 à 14 µm)	Phasics	SID4 DWIR	
Focomètre (546 nm)	Moller-Wedel	MELOS 500	
Autocollimateur électronique	Newport	LDS-Vector	
Autocollimateur	Moller-Wedel	AKR 300/40/17.7 SWL	Angle entre les surfaces optiques
Goniomètre	Moller-Wedel	n/a	
Théodolite	Swisstek	Kern E2	
Machine à mesurer les coordonnées (CMM) avec sonde tactile	Mitutoyo	Bright VC 200 (BRT-710)	Inspection ou alignement 3D
CMM portative avec sonde tactile ou scanner laser	Hexagon	Romer Absolute Arm 7312	

DESCRIPTION	FABRICANT	# MODÈLE	TYPES DE MESURES
Spectrophotomètre, UV-vis-NIR (200 à 2500 nm)	Agilent	Cary 7000 UMS	Spectre de transmission ou de réflexion des composants optiques, des revêtements optiques à couches minces et de divers matériaux
Spectrophotomètre, UV-vis-NIR (200 à 3000 nm)	Perkin Elmer	Lambda 950	
Spectromètre, FTIR (2 à 330 µm)	Bruker	Vertex 70	
Spectromètre à fibre optique (200 à 1100 nm)	Ocean Optics	HR4000	
Spectroradiomètre et photomètre (380 à 780 nm)	Photo Research	PR-680 SpectraDuo	
Spectroradiomètre (350 à 2000 nm)	ASD	FieldSpec 3	
Photomètre et radiomètre	International Light	ILT2500	
Profileur de faisceau laser, avec caméra CCD (190 à 1550 nm)	Ophir-Spiricon	SP620U	Caractérisation du faisceau laser
Profileur de faisceau laser, fente de balayage XY (190 à 1150 nm ou 650 à 1800 nm)	DataRay	Beam R2	
Microscope 3D, interféromètre à lumière blanche (WLI)	Bruker	NPFLEX	Inspection microscopique et analyse des surfaces optiques (rugosité et très petits détails)
Microscope confocal à balayage laser	Olympus	LEXT OLS31-SU	
Microscope électronique à balayage (MEB)	Hitachi	S-3400N	
Microscope numérique	Keyence	VHX-7000	
Microscope optique	Nikon	n/a	
Profilomètre à stylet	Bruker	DektakXT	

CONTACTEZ-NOUS

1 866 657-7406 | info@ino.ca

ino.ca



Québec (Siège social)
2740, rue Einstein
Québec (Québec) G1P 4S4
CANADA
418 657-7006

Montréal
405, avenue Ogilvy, Bureau 101
Montréal (Québec) H3N 1M3
CANADA
438 387-8957

Hamilton
175, Longwood Road South, #316 A
Hamilton (Ontario) L8P 0A1
CANADA
905 529-7016